## Si ナノワイヤー太陽電池の光劣化と Al<sub>2</sub>0<sub>3</sub>によるパッシベーション効果

Light Degradation and Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Passivation Effect of Si Nanowire Solar Cells 東エ大フロンティア研<sup>1</sup>,東工大総理工<sup>2</sup> °宮澤遼太<sup>1</sup>,小路智也<sup>1</sup>,角嶋邦之<sup>2</sup>,片岡好則<sup>2</sup>,

西山彰 ²,杉井信之 ²,若林整 ²,筒井一生 ²,大橋弘通 ¹,名取研二 ¹,岩井洋 ¹

Tokyo Tech. FRC<sup>1</sup>, Tokyo Tech. IGSSE<sup>2</sup> °R. Miyazawa<sup>1</sup>, T. Shoji<sup>1</sup>, K. Kakushima<sup>2</sup>, Y. Kataoka<sup>2</sup>,

A. Nishiyama<sup>2</sup>, N. Sugii<sup>2</sup>, H. Wakabayashi<sup>2</sup>, K. Tsutsui<sup>2</sup>, H. Ohashi<sup>1</sup>, K. Natori<sup>1</sup>, H. Iwai<sup>1</sup>

E-mail: miyazawa.r.ab@m.titech.ac.jp

【研究目的】Si ナノワイヤー太陽電池は高い Surface-to-Volume ratio (S/V 比)を有するため、発電 効率の向上にはキャリア再結合中心となり得る界面準位密度(*D<sub>it</sub>*)の抑制が求められる。*D<sub>it</sub>の高 い面方位を持つ Si ナノワイヤー<sup>[1]</sup>では終端水素脱離による <i>D<sub>it</sub>*の増加が顕著化<sup>[2]</sup>する懸念が有り, 固定電荷を含むパッシベーション膜による再結合抑制が重要となる。本研究では、光照射によっ て発電特性の劣化した横型 Si ナノワイヤー太陽電池の表面に、負の固定電荷を含む Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 膜を原 子層堆積(ALD)で堆積し発電特性の変化と幅依存性を調べた。

【実験方法】Fig.1 に本研究で作製した横型太陽電池の構造図を示す。SOI 基板上にドライエッチ ングにより横型ナノワイヤーを 100 本並列に作製した。表面保護膜には 1000°C, O<sub>2</sub> 雰囲気中で熱 酸化膜(SiO<sub>2</sub>)を形成し、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> はその上に ALD で 5 nm 堆積させた。

【実験結果】Fig.2 に 10000 秒間の 10SUN 光照射前後および Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> パッシベーション後における ナノワイヤー太陽電池の発電特性(AM1.5, 100 mW/cm<sup>2</sup>)を示す。光照射によって減少した *I*<sub>SC</sub> が パッシベーションによって増加していることがわかる。Fig.3 には初期状態と比較した *I*<sub>SC</sub> 増加率 のナノワイヤー幅依存性を示す。光劣化はナノワイヤー幅の微細化により顕著化したが、パッシ ベーション後について幅依存性は見られなかった。以上の結果から、ナノワイヤー幅依存性を持 つ光劣化を Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> パッシベーションによって非顕在化できることがわかった。

【謝辞】本研究は文部科学省「革新的エネルギー研究開発拠点形成事業(FUTURE-PV Innovation)」の委託により行われたものである。



Fig. 1 Schematic illustration for laterally formed silicon nanowire solar cell structure.

Fig.2 *I-V* characteristics. Short-circuit current decrease as 10 SUN irradiated for 10000s and increase as  $ALD-Al_2O_3$  Passivation .

Fig.3 Short-circuit currents increase rate to the initial as a function of nanowire width.

[1] T. Shoji et al., The 74th JSAP Autumn Meeting (2013)

[2] S. Maeda et al., IEEE Int. Reliab. Phys. Symp. 42, 8-12 (2004)